Влияние нарушения подрешеточной симметрии на фазовую диаграмму расширенной модели Хаббарда

С. Д. Мостовой,¹* О.В. Павловский^{2†}

¹ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, кафедра квантовой статистики и теории поля Россия, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 2 ²НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ. Россия, 117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 25 (Поступила в редакцию 14.05.2022; подписана в печать 23.05.2022)

Исследуется влияние нарушения подрешеточной симметрии в расширенной модели Хаббарда на положение фазового перехода полуметалл-антиферромагнетик. Показывается, что задание отличающихся на подрешетках значений интенсивности взаимодействия электронов на одном узле приводит к сдвигу точки фазового перехода. Обсуждается связь с формированием спинового конденсата на подрешетках. Демонстрируются изменения в кинетической и потенциальной энергиях электронов.

РАСS: 05.50.+q, 02.70.-с, 02.70.Uu. УДК: 538.9 Ключевые слова: метод Монте-Карло, модель Хаббарда, графен, нарушение симметрии, фазовый переход.

введение

В настоящей работе рассмотрена расширенная модель Хаббарда [1], применяемая для описания коллективных свойств релятивистских электронов в графене [2] в режиме сильной связи. Одной из задач является теоретическое предсказание тепловых и электрических свойств такой системы при изменениях геометрии, количества и вида атомов примесей, введении подложки. К сожалению, аналитические вычисления с правильным электростатическим потенциалом взаимодействия электронов невозможны. Также необходим учет подрешеточной и спиновой степеней свободы. Перечисленные технические трудности приводят к необходимости разработки численных методов расчета наблюдаемых и корреляторов. Часто используются статическая и динамическая теория среднего поля [3], вспомогательные поля на решетке [4, 5], операторное вторичное квантование [6, 7, 8]. В случае решеточных вычислений применяют аппроксимацию статистической суммы.

Настоящая работа была выполнена при помощи метода Гибридного Монте-Карло со вспомогательными полями Хаббарда с использованием преобразования Хаббарда-Стратоновича согласно методике, изложенной в работах [9, 10]. Целью работы является исследование эффектов, вызываемых нарушением подрешеточной симметрии двух подрешеток графена путем задания отличных друг от друга значений потенциала взаимодействия электронов на одном узле. Это приводит к тому, что электронам энергетически выгодно занимать преимущественно одну из подрешеток. Указанный эффект можно получить на практике при ис-

* sd.mostovoy@physics.msu.ru

пользовании подложек со специальной структурой, такой как у нитрида бора. Одной из экспериментальных работ, описывающих изменение зонной структуры электронов при введении подложки, является [11]. В частности, в ней указано, что использование данной подложки приводит к открытию энергетической щели в электронных состояниях, что может позволить применить графен совместно с полупроводниками для создания электронных устройств.

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОРМАЛИЗМ

В качестве теоретической модели используется расширенная модель Хаббарда на гексогональной решетке с 2 × L × L узлами. Заданы периодические граничные условия. Гамильтониан модели имеет вид

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{U} = -\kappa \sum_{\langle x, y \rangle, \sigma} \left(\hat{a}_{x,\sigma}^{\dagger} \hat{a}_{y,\sigma} + \text{h.c.} \right) + \frac{1}{2} \sum_{x,y} V_{xy} \hat{q}_x \hat{q}_y,$$
(1)

где κ характеризует интенсивность перескока электрона между соседними узлами, $\langle x, y \rangle$ обозначает пару соседних узлов, σ – проекция спина, $\hat{q}_x = \hat{a}_{x,\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{x,\uparrow} + \hat{a}_{x,\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{x,\downarrow} - 1$ есть электрический заряд, и $\hat{a}_{x,\sigma}$ представляет оператор уничтожения электрона со спином σ в узле x. V_{xy} обозначает матрицу электростатического взаимодействия электронов и содержит в своих элементах значения V_{00} (электроны на одном узле), V_{01} (электроны на соседних узлах) или 0. Для вычислений выбрано $\kappa = 2.8$, $V_{01} = 0.8$, а V_{00} меняется в некоторой окрестности значения 3.0. Решеточная дискретизация статистической суммы приводит к формулам следующего вида:

$$\mathcal{Z} = \operatorname{Tr}\left\{e^{-\beta\hat{H}}\right\} = \int \mathcal{D}[\zeta, \zeta^*] \mathcal{D}[\phi, \chi] \times \exp\left\{-S_{\text{HS}} - \zeta^* (MM^{\dagger})^{-1}\zeta\right\}, \quad (2)$$

[†] pavlovsky@physics.msu.ru

$$S_{\text{HS}} = \frac{\delta^{-2}}{2} \phi \tilde{V}^{-1} \phi + \frac{\left(\chi - (1-\alpha)V_{00}\delta^{3/2}\right)^2}{2(1-\alpha)V_{00}}\delta^{-2}, \quad (3)$$

$$\tilde{V}_{xy} = \alpha V_{00} \delta_{xy} + (1 - \alpha) V_{xy}, \qquad (4)$$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -E_{T-1}^{(f)} \\ E_0^{(k)} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_0^{(f)} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_1^{(k)} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E_1^{(f)} & 1 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix},$$
(5)

$$E_t^{(k)} = -\exp\{\kappa\delta\sum_{\substack{x,y,\\\langle a,b\rangle}} (\delta_{ax}\delta_{by} + \delta_{ay}\delta_{bx})\},\qquad(6)$$

$$E_t^{(f)} = -\text{diag}\exp\{-\delta^{-1/2} \left(i\varphi_{xt} + \chi_{xt}\right)\},$$
(7)

где $E_t^{(f)}$ – диагональные матрицы размером $N_s \times N_s$, $N_s = 2L^2$, $E_t^{(k)}$ – плотные матрицы $N_s \times N_s$, $\alpha = 0.95$ – параметр относительного вклада полей Хаббарда φ_{xt} и χ_{xt} . В наших расчетах $\beta = 1/(0.2\kappa)$. Общее число временных слоев достигает 2*T*, где T = 60.

В качестве наблюдаемых использовались стандартные параметры порядка: средний квадрат спина на подрешетке, приведенный к одному узлу, и аналогичная величина заряда. Их можно определить следующим образом:

$$\langle S^2 \rangle = \left\langle \frac{1}{L^4} \left(\sum_{x \in A} \hat{S}_{x,3} \right)^2 \right\rangle + \left\langle \frac{1}{L^4} \left(\sum_{x \in B} \hat{S}_{x,3} \right)^2 \right\rangle, \quad (8)$$

$$\langle q^2 \rangle = \left\langle \frac{1}{L^4} \left(\sum_{x \in A} \hat{q}_x \right)^2 \right\rangle + \left\langle \frac{1}{L^4} \left(\sum_{x \in B} \hat{q}_x \right)^2 \right\rangle, \quad (9)$$

где $\hat{S}_{x,3} = \hat{a}_{x,\uparrow}^{\dagger} \hat{a}_{x,\uparrow} - \hat{a}_{x,\downarrow}^{\dagger} \hat{a}_{x,\downarrow}$ представляет собой проекцию спина в узле x на выделенную ось квантования, L – линейный размер решетки.

Нарушение подрешеточной симметрии вводится путем выбора для каждой из подрешеток своего значения интенсивности взаимодействия V_{00} двух электронов на одном узле. В настоящей работе принято обозначить эти два значения через $V_{00} \pm \Delta$. Таким образом, "ширина" разделения составляет 2Δ , а нарушение является симметричным относительно невозмущенной ситуации (когда $\Delta = 0$). В работе проводились вычисления для $\Delta \leq 0.25$.

2. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На Рис. 1 представлен результат расчета квадратного корня из параметра порядка (8) для решеток двух размеров (L = 6 и L = 8) в ситуациях, когда нарушение подрешеточной симметрии отсутствует, либо составляет $\Delta = 0.2$ для диапазона центрального значения V₀₀ от 2.6 до 4.3. Из графика можно предположить, будто различие результатов имеет место при всех V_{00} , но это лишь артефакт конечного объема решетки, на которой производятся вычисления. Действительно, этот же график демонстрирует существенное влияние эффекта конечного объема (L мало) на получаемые результаты, поэтому требуются дополнительные действия для обработки получаемых результатов. Это может быть выполнено, например, путем проведения ряда расчетов одной и той же величины на решетках разного размера с последующей экстраполяцией по величине обратного линейного размера решетки 1/L к нулю. Получаемый результат считается оценкой значения данной величины при работе с бесконечным листом графена.

Нужно отметить, что применение данной методики для $\Delta = 0$ приводит к правильной оценке положения фазового перехода полуметалл-антиферромагнетик, полученной, например, в работе [12]. Эта величина составляет порядка $V_{00} = 3.8$.



Рис. 1. Поведение параметра порядка (8) для решеток 6 × 6 и 8 × 8 для ситуаций с («gap») и без («pure») нарушения подрешеточной симметрии

Выполненный по экстраполяции переход к пределу бесконечного объема для данных, полученных в результате работы вычислительной программы, дает результат, показанный на Рис. 2. Каждая из приведенных кривых имеет два характерных поведения — в областях малых и больших значений V_{00} . Хотя сильные температурные флуктуации не позволяют точно судить о зависимости параметра порядка *после* фазового перехода, область изменения поведения может

быть локализована достаточно точно. Это позволяет отметить примерное положение точки фазового перехода для каждого значения Δ . Соответствующие V_{00} отмечены вертикальными линиями на Рис. 2. Набор линий показывает устойчивое смещение границы двух фаз влево, в область малых значений параметра V_{00} .

Данный результат может быть объяснен, если учесть, что подрешетка с интенсивностью взаимодействия $V_{00} - \Delta$ перетягивает на себя электроны, которые могут образовать спиновый конденсат на этой подрешетке раньше, чем это произойдет на другой. Под спиновым конденсатом подразумевается ситуация, когда два электрона с противоположными направлениями спинов находятся на одном узле, тогда как на соседнем узле электрона нет (образуется положительный ион атома углерода). Электроны переходят на первую из упомянутых подрешеток в силу энергетической выгодности, поскольку параметр $V_{00} \pm \Delta$ опsite взаимодействия характеризует величину работы по расположению электрона на данном узле. Таким образом, формирование упорядоченной фазы начинается, с точки зрения значений V₀₀, раньше, чем это было бы при $\Delta = 0$. На другой же подрешетке (с интенсивностью on-site взаимодействия $V_{00} + \Delta$) конденсат еще не сформирован, поэтому возникает целая область параметров V₀₀, при которых электроны упорядочены лишь частично, на одной подрешетке.



Рис. 2. Смещение границы двух фаз в область меньших V_{00} при возрастании величины Δ . Границы в каждом конкретном случае выбраны приблизительно, но тенденция к смещению выражена достаточно ярко

Данный факт находит отражение в характере изменения кинетической и потенциальной энергий системы в рассматриваемой области. Рис. З демонстрирует, что в области V_{00} от 3.9 до 4.1 электроны обладают повышенной кинетической энергией. Кинетическая энергия $K = \langle \hat{T} \rangle$ вычислена путем нахождения квантовомеханического среднего первого слагаемого в гамиль-

тониане (1). Это можно объяснить активным перемещением электронов между двумя подрешетками. Также очевиден скачок потенциальной энергии $\Pi = \langle \hat{U} \rangle$ после установления конденсатов на обеих подрешетках, то есть с правой стороны от фазового перехода (начиная с $V_{00} \approx 4.2$).



Рис. 3. Превышение составляющих энергий (в расчете на один узел решетки) в ситуации с $\Delta = 0.1$ над случаем $\Delta = 0$. Можно заметить, что в области параметров от 3.9 до 4.1 происходит перестройка электронной плотности, вызванная последовательным установлением спинового конденсата на каждой из подрешеток

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе показано, что нарушение подрешеточной симметрии в расширенной модели Хаббарда путем введения различия на 2 между значениями интенсивности взаимодействия электронов на одном узле приводит к направленному смещению границы фазового перехода полуметалл-антиферромагнетик в область малых значений V₀₀. Это наблюдение представляет интерес, потому что именно в этой области параметров модели, как оценивают, существует точка физического состояния графена. Ее положение может быть описано [13] значениями $V_{00} \approx 3.27, V_{01} \approx 0.8$. Поскольку, с физической точки зрения, подрешеточная симметрия может быть нарушена путем выбора подходящей подложки (в качестве примера можно привести работу [11]), то сказанное означает, что, возможно, существует способ получить графен в фазе, отличной от полуметалла. Это может быть использовано в области наноэлектроники и спинтроники.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 21-12-00237).

- Smith D., Von Smekal L. // Phys. Rev. B. 2014. 89, 195429.
- [2] Novoselov K., Geim A., Morozov S., Jiang D. et al. // Science. 2004. 306. P. 666.
- [3] Raczkowski M. et al. // Phys. Rev. B. 2020. 101, 125103.
- [4] Drut J. E., Lahde T. A. // Phys.Rev. B. 2009. 79, 165425.
- [5] Classen L., Herbut I. F., Janssen L., Scherer M. M. // Phys. Rev. B. 2015. 92, 035429.
- [6] Peters R., Kawakami N. // Phys. Rev. B. 2014. 89, 155134.
- [7] Murakami M. // J. Phys. Soc. Jpn. 2000. 69, 1113.

- [8] Paki J., Terletska H., Iskakov S., Gull E. // Phys. Rev. B. 2019. 99, 245146.
- [9] Buividovich P., Smith D., Ulybyshev M., Von Smekal L. // Phys. Rev. B. 2018. 98, 235129.
- [10] Buividovich P., Smith D., Ulybyshev M., Von Smekal L. // Phys. Rev. B. 2019. 99, 205434.
- [11] Mao J., Jiang Y., Moldovan D., Li G., Watanabe K., Taniguchi T. et al. // Nature Physics. 2016. 12. P. 545.
- [12] Wu W. and Tremblay A.-M. S. // Phys. Rev. B. 2014. 89, 205128.
- [13] Wehling T. O., Sasloglu E., Friedrich C. // Phys. Rev. Lett. 2011. 106, 236805.

Effect of sublattice symmetry breaking on the phase diagram of the extended Hubbard model

S. D. Mostovoy^{1a}, O. V. Pavlovsky^{2b}

¹Department of Quantum statistics and field theory, Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University

Moscow 119991, Russia

²National Research Centre «Kurchatov Institute» – ITEP. Moscow 117218, Russia

 $E\text{-mail: }^{a}sd.mostovoy@physics.msu.ru, \ ^{b}pavlovsky@physics.msu.ru$

The effect of sublattice symmetry breaking in the extended Hubbard model on the position of semimetal-antiferromagnet phase transition is considered. It is shown that setting different values of on-site interaction intensity on the sublattices leads to a shift of the phase transition point. The formation of spin condensate on sublattices is discussed. Changes in kinetic and potential energies of electrons are demonstrated.

PACS: 05.50.+q, 02.70.-c, 02.70.Uu.

Keywords: Monte Carlo method, Habbard model, graphene, symmetry breaking, phase transition. *Received 14 May 2022.*

Сведения об авторах

1. Мостовой Сергей Дмитриевич — аспирант; тел.: (495) 939-12-90, e-mail: sd.mostovoy@physics.msu.ru.

2. Павловский Олег Владимирович — канд. физ.-мат. наук, снс; тел.: (495) 939-12-90, e-mail: pavlovsky@physics.msu.ru.